

X線回折装置

設備・装置名	X線回折装置
技術相談	可能
共同研究	可能
管理担当者	主担当: 物質・生物系長
	副担当: なし
設置場所	物質・生物系棟1F, X線室
仕様	(1) SmartLab(リガク) (2) 回転対陰極式9kW(45kW, 200mA) (3) 光学系切替による多様な測定が可能(集中光学系, 平行ビーム光学系, 微小部光学系, 透過小角散乱光学系, In-plane回折光学系)
主な用途	(1) 集中光学系による多結晶試料測定 (2) 平行ビーム光学系による薄膜試料測定 (3) 単結晶試料, 膜厚測定 (4) 透過小角散乱光学系によるナノ材料の評価 (5) 微小部光学系による微小領域・微量測定 (6) In-plane光学系による極薄膜測定, 深さ方向分析
キーワード	結晶構造解析、定性分析(化合物同定)、薄膜測定、多層膜測定

